科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 26 年 5月 27 日現在

機関番号: 3 2 6 2 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2011 ~ 2013
課題番号: 2 3 6 5 6 0 2 2
研究課題名(和文)原子層堆積法による室温強磁性強誘電体人工超格子の成長
研究課題名(英文)Growth of RT multiferroic artificial superlattice using ALD
研究代表者
坂間 弘(Sakama, Hiroshi)
上智大学・理工学部・教授
研究者番号:1 0 2 4 2 0 1 7
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 1,800,000 円 、(間接経費) 540,000 円

研究成果の概要(和文):ペロフスカイト遷移金属酸化物BiFe03の薄膜によって、環境に有害な鉛を含まない強誘電体 を開発することを目的として研究を行った。特に、本研究ではALD法を製膜方法として選び、BiFe03の層状成長を目指 した。ALD法では、低温での成長が可能であるといった点が強みになる。 最初は、金属原子を1種類だけ含むBiとFeの酸化物の薄膜を作製した。BiとFeの原料としては、低温で分解しやすいBi (Ph)3、Fe(Cp)2を試した結果、基板温度250~350 において、BiとFeの酸化物の薄膜の層状成長に成功した。そして、 これらの原料を組み合せることによって目的のBiFe03薄膜の層状成長に成功した。

研究成果の概要(英文): The aim of the present study is to develop ferroelectric materials without lead wh ich is harmful to environment. In particular, this study has been carried out with the aim of layer-by-lay er growth of BiFe03 using atomic layer deposition (ALD). One of the advantage of ALD is the ability of gro wth at low temperature. At first oxide films which include either Fe or Bi were fabricated Using Bi(ph)3 and Fe(Cp)2 as Bi and F

At first, oxide films which include either Fe or Bi were fabricated. Using Bi(ph)3 and Fe(Cp)2 as Bi and F e precursors which are easily decomposed at low tenperature, oxide films of Bi and Fe were successfully fo rmed. In addition, the combination of Bi(ph)3 and Fe(Cp)2 results in the layer-by-layer growth of BiFeO3 u sing ALD.

研究分野:工学

科研費の分科・細目:応用物理学・工学基礎、応用物性・結晶工学

キーワード: 強磁性強誘電体 エピタキシャル 磁気材料 誘電体材料 超格子

1.研究開始当初の背景

(1)強磁性強誘電体の研究は 1960 年代か ら行われているが、近年には特に応用面での 期待から非常に多くの研究がなされるように なって来た。その応用面での期待とは、高速 に応答しかつ極めて消費電力の小さい誘電 体・磁性体デバイスである。

(2)しかし、今まで多くの研究が行われて きたにもかかわらず、室温以上で強磁性と強 誘電性を同時示す物質は見つかっていない。 研究代表者らは、室温以上で安定な強誘電性 を示す物質の中から適当なものを選び出して それに強磁性を付与するというコンセプトで、 室温以上で安定な強磁性強誘電体の創製を目 指して来た。そして、SrTiO₃(111)基板上に BiFeO₃とBiCrO₃をPLD法を用いて交互に1原 子層ずつ堆積することによって、これらの2 つの物質による超格子(BiFeO₃/BiCrO₃ 超格 子)を人工的に作製した。

(3)しかし、この室温強磁性強誘電体を実 用化し各種デバイスに利用するために解決し なければならない課題が2つ浮上した。1つは、 現時点において達成できている超格子が極め て薄い(2nm 程度、10 原子層)こと、もう1つ は、理論的に予測される磁化よりも小さい磁 化しか生じていないことである。

2.研究の目的

(1)上記の課題は、成長を10原子層程度行 うと成長モードが層状から島状に変化してし まい、層状成長の制御が不可能になるために 生じる。また、PLD法では成長が500以上の 高温で行われるため、交互にBiFeO₃とBiCrO₃ を堆積しても成長中にFe³⁺とCr³⁺が置き換わ り、Fe³⁺と Cr³⁺の規則的配列が壊れてしまい磁 化が減少する。

(2)そこで、より低温において成長モード が層状でなくても単原子層成長の可能な ALD 法で、いままでより格段に厚い数百 nm の厚み の BiFeO₃ / BiCrO₃ 人工超格子を作製すること を目指した。特に本研究では、その第一段階 として BiFeO₃の層状成長を試みた。

3.研究の方法

(1) ALD 装置としては、Cambridge Nanotech 社製の装置 (Savannah-100) を用いた。最初 は、金属原子を1種類だけ含む Biか Feの酸 化物の薄膜を作製した。その場合の条件をも とに、Fe 原料、Bi 原料、酸化剤を交互に注入 することで、BiとFeの酸化物を作製した。 Fe 原料として Fe(Cp)2 等、Bi 原料として Bi(Ph)₃等、酸化剤として水またはオゾンを用 いた。オゾンはオゾンジェネレーターによっ て発生させた。Fe(Cp)。、Bi(Ph)。はいずれも 常温で固体原料であるため、原料の入ってい るシリンダーの温度を上昇させることで蒸気 圧を高め、リアクター内に導入した。シリン ダーの温度は重要なパラメーターである。そ れ以外に変えたパラメーターは、リアクター (基板)温度、Fe 原料と Bi 原料、酸化剤を 注入するパルス時間、残留原料を除去するパ ージ時間、およびサイクル数である。

(2)できた薄膜の結晶構造および結晶性は、 粉末X線回折(XRD)によって調べた。薄膜の 組成および成分元素の価数、ならびに電子状 態をX線光電子分光法(XPS)により調べた。 さらに、薄膜の表面形状を走査型電子顕微鏡 (SEM)および原子間力顕微鏡(AFM)により 調べた。

4.研究成果

(1)まず Fe の酸化物の薄膜を作製した。 Fe(Cp)₂の温度は最適値である 80 に固定し た。また、オゾンパルス時間、Fe(Cp)₂のパル ス時間はそれぞれ1秒、5秒である。Si(100) 基板上にリアクター温度 250 で成膜した場 合、XRD スペクトルにピークは現れないため、 膜はアモルファスである。その膜を 500 以 上でアニールすることで結晶化した。ピーク 位置から、 -Fe₂O₃の多結晶相が生成したこ とが確認された。

(2)次に、Si(100)基板上の成長においてリ アクター温度、成膜サイクルの回数を変え、 膜厚と自乗平均粗さを SEM と AFM で調べた。 サイクル数と膜厚の結果を図1に示す。



図1 サイクル数と膜厚の関係

すべての温度で、膜厚はサイクル数に比例 する。また、高温のとき成膜速度と粗さはと もに大きく、低温のとき成膜速度と粗さはと もに小さかった。そして、250 と290 の間 で成膜の様相が変化した。すなわち、成膜速 度と自乗平均粗さは不連続に変化した。した がって、250 以下では単層成長をしているが、 290 以上では多層成長をしていると考えられる。

(3)次に、基板を変えて同様に成膜を試みた。 MgAI₂0₄(100) 基 板 上 に お い て は、

-Fe₂O₃(100)の成長が確認 された。これは、
MgAl₂O₄(100)と -Fe₂O₃(100)の格子ミスマッチが 3%と十分小さいため、 -Fe₂O₃(100)が選択的に成長したと考えることができる。
しかし、リアクター温度が上昇すると
-Fe₂O₃ピークは増大するが、290 を超えると減少する。これは、300 以上で熱力学的に
-Fe₂O₃が安定相であるために、300 以上で

-Fe₂O₃ が不安定になるためであると考えられる。さらに 550 のアニールで XRD スペクトルにおいて -Fe₂O₃ 以外のピークも完全に 消失した。これは、一旦 -Fe₂O₃ ができたあ とに、膜全体で安定相である -Fe₂O₃ に変化 するのは困難であることを意味する。

(4) YSZ(100) 基板上においては、 -Fe₂0₃(100)の成長が確認された。これも、

-Fe₂O₃とYSZ(100)の格子ミスマッチが2%と 十分小さいためであると思われる。また、XPS で Fe3p の内殻準位からの光電子ピークを測 定した結果、作製したすべての膜では Fe は Fe⁺³になっていることがわかった。すなわち、 今回 Fe₃O₄の成長は認められなかった。

(5)次に Fe 原料を Fe(acac)₂に変えて同 様の成膜を試みた。しかし、装置的に可能 な最大の原料温度 200 においても成膜に 充分な蒸気圧を得ることができなかった。 これは Fe(acac)₂が、Fe(Cp)₂と比べて融点が 高く、したがって同じ温度での蒸気圧が低い ためであると考えられ、ALD の原料として適 当ではないことがわかった。そこで、これ以 降の実験では Fe 原料は Fe(Cp)₂に絞った。

(6) さらに、Bi (Ph) と水またはオゾンを用 いて Bi 酸化物の成長を試みた。基板は Si(100)または SrTiO₃(100)である。Bi(Ph)₃ の温度は最適値である 150 に固定した。オ ゾンと水のパルス時間、Bi(Ph)₃のパルス時間 はそれぞれ1秒、10秒である。基板上にリ アクター温度 250 あるいは 350 で成膜し た場合、Si(100)、SrTiO₃(100)いずれにおい ても、Fe と同様に XRD スペクトルにピークは 現れないため、膜はアモルファスであると考 えられる。SrTiO₃(100)上の場合、その膜を 500 以上でアニールすることで結晶化した。 XRD スペクトルのピーク位置から、 β -Bi₂O₃相 が生成したことが確認された(図2),Si(100) 上に成膜した場合、500 以上でも結晶化され なかった。また、いずれの場合でも 250 以 下で単層成長していることがわかった。



図 2 SrTiO₃(100)上のβ-Bi₂O₃相からの XRD スペクトル

(7)次に、今までの実験で得られた最適条
 件を使って、BiFeO₃の成長を試みた。基板上
 に Fe(Cp)₂、オゾン、Bi(Ph)₃、オゾンをこの

順番に供給し、これを1サイクルとして一定 回数繰り返すことで成膜を行った。リアクタ ー温度は、Fe、Bi いずれにおいても単層成長 する250 または350 に設定した。Fe(Cp)₂、 Bi (Ph)₃ とオゾンのパルス時間は、Fe 酸化物 と Bi 酸化物の成長の場合と同様である。その 結果、BiFeO₃の成長に成功した。ただし、リ アクター温度250 または350 の場合はXRD スペクトルに基板以外のピークは現れない。 成膜後500 以上でアニールすることで結晶 性の BiFeO₃が生成した。図3にXRD スペクト ルを示す。



図 3 SrTiO₃(100)上のBiFeO₃相からのXRDス ペクトル

5.主な発表論文等

[学会発表](計2件)

田中優、田沼格、<u>坂間弘</u>,原子層成長法に よる酸化鉄の成長,第61回応用物理学会春 季学術講演会,2014年3月18日,青山 学院大学相模原キャンパス

江森万里、田沼格、干場光、荒井拓郎、徳
 安良太、<u>坂間弘</u>, SrTiO3(111)上のSrRuO3薄膜
 の成長,第59回応用物理学関係連合講演会,
 2012年3月15日,早稲田大学早稲田キャンパス

[その他]

ホームページ

http://www.ph.sophia.ac.jp/~saka-ken/res earch/multiferro/

6 . 研究組織

(1)研究代表者

坂間 弘 (SAKAMA, Hiroshi)
 上智大学・理工学部・教授
 研究者番号 : 10242017